

Test von Schaltungen und Systemen <i>Test Methods of Circuits and Systems</i>							Modulnummer: MB-701.08													
Master Pflicht/Wahl <input type="checkbox"/> Wahl <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> Ergänzung <input type="checkbox"/> Sonderfall <input type="checkbox"/>				Zugeordnet zu Masterprofil <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Basis</td> <td style="text-align: right;">Ergänzung</td> </tr> <tr> <td>Sicherheit und Qualität (SQ)</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>KI, Kognition, Robotik (KIKR)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Digitale Medien und Interaktion (DMI)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Basis	Ergänzung	Sicherheit und Qualität (SQ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KI, Kognition, Robotik (KIKR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Digitale Medien und Interaktion (DMI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Basis	Ergänzung																		
Sicherheit und Qualität (SQ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
KI, Kognition, Robotik (KIKR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Digitale Medien und Interaktion (DMI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Modulbereich: Praktische und Technische Informatik Modulteilbereich: 701 Rechnerarchitektur																				
Anzahl der SWS		V	UE	K	S	Prak.	Proj.	Σ	Kreditpunkte: 6 Turnus i.d.R. angeboten alle 2 Semester											
		2	2	0	0	0	0	4												
Formale Voraussetzungen: -																				
Inhaltliche Voraussetzungen: -																				
Vorgesehenes Semester: ab 1. Semester																				
Sprache: Deutsch																				
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> • Das Problem des Testens verstehen und erklären können • Den Testverlauf für Schaltungen und Systeme kennen und anwenden können • Klassische und moderne Testverfahren kennen und anwenden können • Die Algorithmen auf (Schaltkreis-)Graphen anwenden können • Die Komplexität der Verfahren verstehen und erklären können 																				
Inhalte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Physikalische Fehlerursachen 2. Abstraktion von der physikalischen Ebene, Fehlermodelle 3. Algorithmen zur Berechnung von Signalwahrscheinlichkeiten 4. Techniken zur Manipulation Boolescher Funktionen 5. Algorithmen zur Fehlersimulation 6. Algorithmen zur Testmuster-generierung 7. Nutzung strukturellen Wissens zur Effizienzsteigerung 8. Techniken zur Reduktion des Suchraumes, Fehleräquivalenz und -dominanz <p>Aus den Inhalten ist deutlich zu erkennen, dass theoretisch/methodische Grundlagen einen wichtigen Teil dieser Vorlesung darstellen. Darüber hinaus werden für die vorgestellten Verfahren die Komplexitäten hinsichtlich Laufzeit und Speicher betrachtet.</p>																				
Unterlagen (Skripte, Literatur, Programme usw.): <ul style="list-style-type: none"> • M.L. Bushnell, V.D. Agrawal: Essentials of Electronic Testing – for Digital, Memory & Mixed-Signal VLSI Circuits, New York: Springer, 2000. • N. Jha, S. Gupta: Testing of Digital Systems, Cambridge University Press, 2003. • A. Miczo: Digital Logic Testing and Simulation, 2. Auflage, Wiley, 2003. • H. Wojtkowiak: Test und Testbarkeit digitaler Schaltungen, Teubner, 1988. • H.-J. Wunderlich: Hochintegrierte Schaltungen: Prüfgerechter Entwurf und Test, Berlin: Springer, 1991. 																				
Form der Prüfung: i. d. R. Bearbeitung von Übungsaufgaben und Fachgespräch oder mündliche Prüfung																				

Arbeitsaufwand	Präsenz	56 h
	Übungsbetrieb/Prüfungsvorbereitung	124 h
	Summe	180 h
Lehrende: Prof. Dr. R. Drechsler		Verantwortlich: Prof. Dr. R. Drechsler